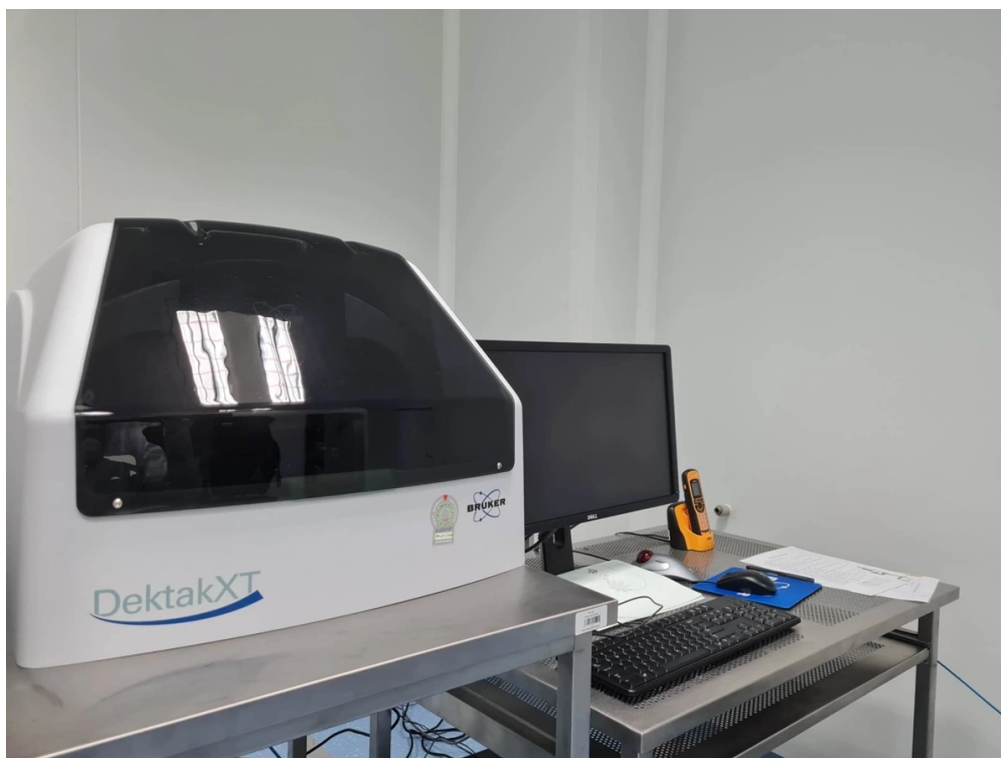


Profilometr do pomiarów warstw o wymiarach nanometrycznych



Opis techniczny:

Profilometr igłowy stykowy służący badaniu chropowatości oraz falistości powierzchni z rozdzielczością 1 Å oraz powtarzalnością na poziomie 4 \AA (angstrom).

Nazwa handlowa: Profilometr Bruker DektakXT

Więcej szczegółów: </equipment/profilometr-do-pomiarow-warstw-o-wymiarach-nanomet/>

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Jurzecka-Szymacha Maria

Osoba kontaktowa - adres strony www: <https://skos.agh.edu.pl/osoba/maria-jurzecka-szymacha-7600.html>

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespół: Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach

Data ostatniej aktualizacji: 28 listopada 2024 14:44

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2013

Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

Aparatura pozwala na mierzenie grubości nanoszonych przez użytkownika cienkich warstw, tworzenie profili w określonych kierunkach i eksport wartości, wraz z przeliczeniem chropowatości.

Warunki udostępniania infrastruktury:

Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (<https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/>)